Micro-LED 器件工作原理、工艺实现方法及未来发展 趋势和挑战

姓名 李霄奕; 学号 PB21511897

摘 要

近年来,半导体光电技术持续发展。同时,伴随着便携式显示设备的大规模应用,用户对于低功耗、高亮度、高分辨率的显示技术的需求不断提升。其中,属于在发光二极管(LED)技术日渐成熟的背景下,微型发光二极管(Micro LED)应运而生,它融合了半导体微纳加工技术。相比于液晶(LCD),它不需要使用背光板,而是直接发出对应颜色的光。跟同属于新一代显示技术的竞争对手一有机发光二极管(OLED)相比,Micro LED 具有高亮度、长寿命、快速响应时间、工作温度范围宽和光转换效率高等优点,使其成为下一代显示技术的重要候选。但同时,也存在制造成本高等缺点。本文对 Micro LED 的发光原理、制造工艺进行介绍,并在最后分析目前 Micro LED 面临的困难和挑战,并对 Micro LED 的未来进行展望。

关键字: Micro-LED, 工作原理, 工艺实现原理, 发展前景, 技术趋势

目 录

摘要	
目录	2
第一章 绪论	3
1.1 研究背景及发展历程 3	3
1.2 章节安排 3	3
第二章 MICRO LED 工作原理	5
2.1 发光原理	5
2.2 控制原理	5
第三章 MICRO LED 的工艺实现方法	7
3.1 像素点的工艺实现 7	7
3.1.1 倒装结构 7	7
3.1.2 垂直结构	3
3.2 全彩阵列的工艺实现10	
3.2.1 金属微凸点制备技术10	
3.2.2 巨量转移技术 11	
第四章 MICRO LED 面临的挑战 12	2
4.1 技术方面的挑战 12	
4.1.1 巨量转移技术 12	
4.1.2 全彩技术 12	
4.1.3 驱动技术 12	
4.1.4 修复技术 12	
4.2 市场方面的挑战13	
4.2.1 成本	
4.2.2 竞品	
4.2.3 使用场景13	
第五章 总结 14	1

第一章 绪论

1.1研究背景及发展历程

Micro LED 发源于传统的 LED 技术,传统的 LED 大小从 1mm 到 150μm 不等。传统的 LED 对显示技术的运用在于作为 LCD 的背光板。随着 LCD 的技术发展,为了解决显示黑色时带来的对比度不佳,作为背光板的 LED 灯珠制程开始缩小,这同时也发展出更多用途(见图 1),其中的代表就是 Mini LED,Mini LED 通过分区控制背光亮度从而实现更高的对比度和更低的功耗。但是,Mini LED 只能算是 LCD 背光技术的升级,并没有从物理层面上进行突破。

有机发光二极管(Organic Light-emitting Diode)简称 OLED,如图 2,相比于 LCD,OLED 属于自发光器件,跳过了由于过滤偏振光和绿光板而带来的能量损耗,同时,OLED 的发光是由正负极通电强弱所决定的,而每个正负极都能够单独控制,因此,可以单独控制每个像素点。在显示黑色区块较多的图片时,相比于 LCD 能带来更低的功耗和更高的对比度。同时,因为更少的器件层,OLED 也能够降低屏幕所需厚度,有利于对便携式设备的应用。但是,OLED 属于有机材料,在使用过程中,正负极的电子迁移会导致有机分子老化,长期发出单一颜色的像素点会亮度降低,像素点不均匀导致屏幕产生色差,俗称烧屏。

2000 年,德州理工大学的 Hongxing Jiang 和 Jingyu Lin 发明了 Micro LED^[1]。相比于 OLED,这种器件将 OLED 中的有机材料换成了无机材料 GaN。这有效地提高了发光器件的 寿命。相比于 LED,Micro LED 实质上就是将 LED 薄膜化、小型化、矩阵化的产物。和传统 LCD 相比,Micro LED 和 OLED 的优点相同——正负极像素点的单独调控、直接发光带来的发光效率提升。但是相比于 OLED 的工艺成熟,目前 Micro LED 仍然存在大量成本以及良品率的问题。但即便如此,这种高密度的阵列器件具有高亮度、低能耗、快响应、高分辨率、高对比度和长寿命等优势(如图 3)^[2-4],逐渐在微型显示、可见光通信、生物医学、无掩膜光刻等方面得到应用。^[5-9]

1.2章节安排

本文主要研究了 Micro LED 的工作原理、制作工艺、以及在生产过程中遇到的问题和挑战,同时提出了相应的解决策略。最后,本文对未来 Micro LED 技术的发展方向和趋势进行了预测和总结。

全文结构如下:

第一章为绪论,主要阐述了本研究的背景、发展历程,同时概述了国内外研究现状,并介绍了本文的结构安排。

第二章是对 Micro LED 工作原理的简要概述。

第三章详细介绍了 Micro LED 的制作工艺,以及在其制备过程中可能。

第四章则是探讨了 Micro-LED 遇到的问题和挑战,并提出了相应的解决方案。

第五章对全文做出总结。



图 1 LED 制程的缩小以及带来的相关应用

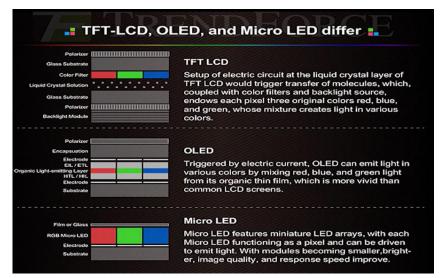


图 2 不同发光器件的结构对比

Technology	Liquid Crystal	Organic LED	III-nitride	Digital light	Laser beam
			μLED	µLED processing st	
Mechanism	Backlighting/LE D	Self-emissive	Self-emissive	Backlighting/L ED	Backlighting LD
Luminous efficacy	Medium	Low	High	High	High
Luminance	3000 cd/m ² (full color) ~ 10 ⁴ cd/m ² (green)	1500 cd/m ² (full color) ~ 10 ³ cd/m ² (yellow)	$\sim 10^5 \text{ cd/m}^2$ (full color) $\sim 10^7 \text{ cd/m}^2$ (blue/green)	~ 1000 cd/m ² (full color)	~ 1000 cd/m (full color)
Contrast ratio	200: 1 (intrinsic)	Very high > 10,000:1	Very high > 10,000:1	High	High
Response time	ms	μs	ns	ms	ms
Operating temperature	0 to 60 °C Requires heater	-50 to 70 °C	-100 to 120 °C	To be determined	To be determined
Shock Resistance	Low	Medium	High	Medium	Medium
Lifetime	Medium	Medium	Long	Medium [limited by MEMS]	Short [limited by laser diodes]
Cost	Low	Low	Low	High	High

图 3 不同显示技术的性能对比

第二章 Micro LED 工作原理

2.1 发光原理

Micro LED 发光本质上和 LED 发光原理相同,如图 4,LED 本质上是一个二极管,二极管正向导通时,电子从 N 区扩散至 P 区,在 P 区的导带与价带空穴复合,损失的能量以光子的形式散发出去,这就是 LED 的发光原理,通过改变不同的材料,我们能够调整导带与价带的位置,实现不同的带隙宽度,实现不同的光子能量,从而实现不同的光的频率,即光的颜色。

随着技术发展,相比于同异质结结构,双异质结结构能够有效提高复合效率。双异质结结构由 P 型和 N 型的宽带隙半导体组成,并且把窄带隙半导体材料掺杂在在 P 型半导体材料和 N 型半导体材料之间,窄带隙材料能有效对过剩载流子进行限制,从而促进器件中电子和空穴的复合。

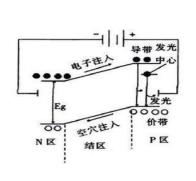
根据不同的带隙宽度,常用的 LED 材料包括 GaP/GaAsP(红光)、AlGaAs(红外光)、AlGaInP(长波)和 GaN(蓝光)四类 III-V 族材料。^[10]

不同颜色的 LED 的影响因素可能会略有参差,例如,在带宽方面,蓝色发光二极管会受到 RC 时间常数的限制,而绿色发光二极管则受到载流子复合速率的限制。[11]

2.2 控制原理

MicroLED 的一个关键特点是它们可以单独控制,这意味着每个微小的 LED 单元可以独立开关,从而实现极高的对比度和精确的局部调光。通过组合三个可以独立发光的子像素(红色、绿色和蓝色),MicroLED 显示器可以产生多种颜色并实现高分辨率。

对于光强,分为模拟调制和 PWM 调制,模拟调制即控制加在每个像素点的电压来控制光强,而 PWM 调制则是通过外部时钟或震荡电路,控制像素点电压的占空比,来达到控制发光的时间,通常来讲,PWM 调光的频率需要高于 2000Hz 才能使得人眼较为舒适和安全。其中,一种较为创新型的 PWM 调光电路为 7T1C 脉冲幅度调制(Pulse Amplitude Modulation, PAM) 电路^[12],如图 5。





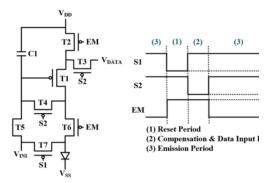


图 5 7T1C 脉冲幅度调制电路

对于寻址,也有两种方式,一种叫无源寻址,一种叫有源寻址,无源寻址的 Micro-LED 同列 LED 共用 n 电极,同排 LED 共用 p 电极,如图 6 所示。有源寻址的的 Micro-LED 则是全部像素点共用 n 电极,每个像素点有单独的 p 电极控制,有源寻址的方式具有更高的

驱动精度控制,相比于无源驱动,行列扫描线的电阻对有源驱动的影响更小,Micro-LED 的集成密度也能相应提升,如图 7 所示。 $^{[13]}$

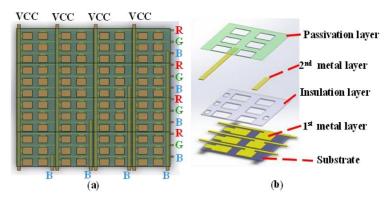


图 6 无源寻址的背板设计图

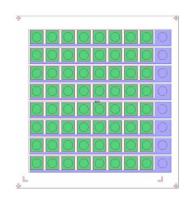


图 7 有源寻址的布局图

第三章 Micro LED 的工艺实现方法

3.1 像素点的工艺实现

细化到像素点的结构,目前较为主流的结构有两种:倒装结构和垂直结构

3.1.1 倒装结构

倒装结构 Micro-LED 具有工艺简单、热阻抗低、排列密度高等优点,在需要较高发光功率和发光稳定性的场合中发挥着重要作用。图 8 显示了其中一种倒装结构的 3D 图。

本文以一种生长在蓝宝石衬底上的 GaN 的 Micro-LED 为例,介绍该倒装结构 Micro-LED 的制备方法。

图 9 标出了该器件的各层材料信息,制备方法如下:

- 1. LED 外延片激活、清洗: 在氮气中加热 500 摄氏度 15 分钟, 激活镁离子(类似于退火), 然后用盐酸、硫酸、双氧水等试剂清洗表面, 除去玷污, 然后烘干。
- 2. ITO 膜生长: 使用电子束在表面蒸镀一层 ITO 膜。
- 3. ITO 膜的形状: 光刻,对 ITO 进行湿法刻蚀,随后快速退火。
- 4. SiO₂掩膜: 光刻,分别使用磁控溅射和电子束蒸镀生长二氧化硅,再去胶。
- 5. 干法刻蚀:利用 SiO2 作为保护层,进行干法刻蚀,再去除二氧化硅。
- 6. 制备 n 电极: 光刻,再使用热蒸发和电子束蒸镀制备 n 电极金属。
- 7. 制备介质层:用 PECVD 制备介质膜,光刻,再使用干法刻蚀
- 8. 制备 p 电极: 光刻,再使用热蒸发和电子束蒸镀制备 p 电极金属图 10 展示了制备倒装结构的工艺流程效果图。

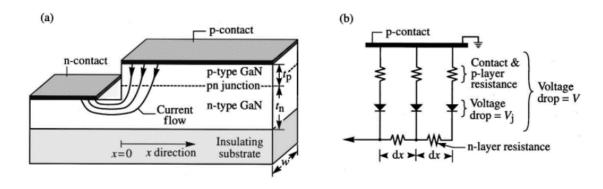


图 8 倒装结构的简化模型图

Layer type	Material	Thickness	Doping type
p-layer	p-GaN	0.2 μm	Mg-doping, 1.0×10 ²⁰ cm ⁻³
Electron blocking layer	AlGaN	0.2 μm	Mg-doping, 1.5×10 ²⁰ cm ⁻³
MQWs	GaN/InGaN	75 nm	-
n-layer	n-GaN	2 μm	Si-doping, 5×10 ¹⁸ cm ⁻³
Buffer layer	u-GaN	3 μm	No doping
Sapphire substrate	Al_2O_3	650 μm	No doping

图 9 倒装结构 Micro-LED 的各层材料信息

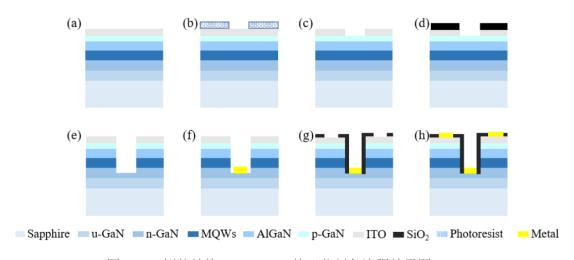


图 10 倒装结构 Micro-LED 的工艺制备流程效果图

3.1.2 垂直结构

相比于倒装结构的 Micro-LED,垂直结构的形态的光的功率更高,电阻也更低,更适合一些高效率和高功率的照明场景。但是,相应的工艺也更加的复杂,也存在诸多问题,比如刻蚀带来的侧壁损失、P型反射镜的不足、金属键合方案的优化等等。

本文以如图 11 所示的垂直型结构的红光 AlGaInP 的 Micro-LED 为例,介绍垂直型结构的 Micro-LED 阵列的制备流程。

- 1. 外延片的生长制备:使用 MOCVD,在 GaAs 衬底上分别从下往上生长 n-GaInP、n-GaAs、n-AlGaInP、若干层的 GaInP 和 AlGaInP 来形成多量子阱(MQWS),p-AlInP、p-AlGaInP、p-GaP
- 2. 电流阻挡层(CBL)的制备: 沉积二氧化硅层,并开孔,作为电流阻挡层
- 3. p 电极制备和晶圆键合:使用硅晶圆,正面制备 Cr 等金属,反面制备 Ti 等金属,然后在热和压力的作用下,键合金属和器件连接,制备出 p 电极,形成欧姆接触,同时也是 p 型反射镜。
- 4. 去除衬底:将器件翻面,使用湿法腐蚀去除 GaAs 衬底和 n-GaInP 缓冲层,为接下来的 n 电极制备做准备。
- 5. 像素分离: 因为需要干法刻蚀的深度较深, 先用磁控溅射和电子束蒸镀制备二氧化

硅掩模版,然后进行干法刻蚀至 CBL 层,这能将一个个像素分离,然后使用 PI 等绝缘性物质填充刻蚀缝隙,进行电学绝缘。

6. n 电极制备: 在分离好的像素上面制备出金属,作为 n 电极。

图 12 展示了大致的制备工艺流程

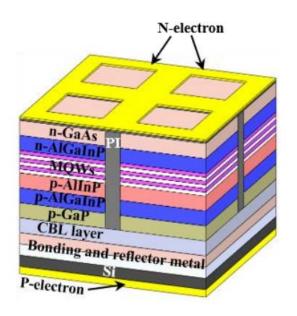


图 11 垂直结构 Micro-LED 的器件 3D 图

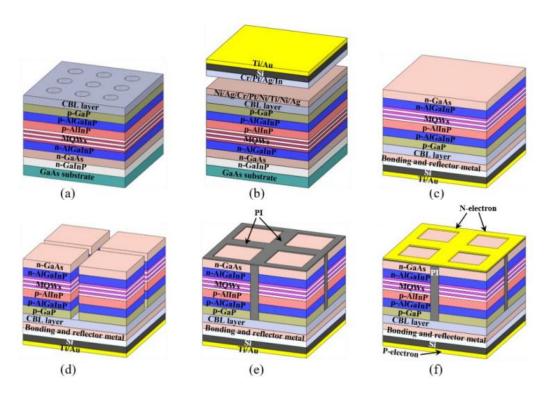


图 12 垂直结构 Micro-LED 的工艺制备流程效果图

3.2 全彩阵列的工艺实现

上述讨论的制备工艺都是针对单个像素点的器件单元制备流程,但是想要实现全彩的显示屏,就需要把红、绿、蓝三种颜色的显示单元集成到同一系统中,以下介绍几种常见的键合过程中的关键工艺方法。

3.2.1 金属微凸点制备技术

制备微凸点阵列的技术手段主要有两大类:一类是事先做好金属圆球,然后控制相关设备将金属球放置在基板上来形成微凸点阵列,例如植球法;另一类则不事先制备金属球,而是直接在晶圆上制造金属球,比如丝网印刷法、钉头凸点法、电镀法、蒸镀法、可控塌陷芯片连接新工艺(C4NP)以及喷射法。下面着重介绍其中的钉头凸点法。

Matsushita 公司于 1997 年通过对引线键合的技术研究[14-15],成功衍生出钉头凸点法^[16],主要过程为:

- 1. 电火花放电融化金属在金属丝末端形成球状凸点。
- 2. 劈刀夹断金属凸点。
- 3. 在超声波、热量、压力的共同作用下,将金属球键合到基板上
- 4. 劈刀抬起,转向制备下一个金属微凸点
- 5. 制备完所有微凸点,统一进行平坦化工艺,去除尾部 图 13 展示了大致的工艺过程。

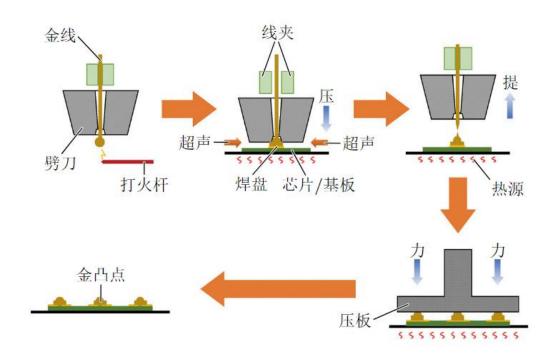


图 13 钉头凸点法工艺流程示意图

3.2.2 巨量转移技术

巨量转移技术作为实现实际 Micro-LED 屏幕的关键技术,目前处于各国科技的交锋,技术路线百花齐放,并且各个技术路线齐头并进,并不存在先后顺序和相互借鉴的情况。可以大致将巨量转移技术路线分为三大类:自组装、整体转移和拾取转移。对于拾取转移,又可分为真空拾取、静电拾取、磁拾取、转膜印刷。其中几种主要的技术路线如图 14 所示。

通过对屏幕尺寸的区分,可以分为小尺寸屏幕和大尺寸屏幕,其中制备小尺寸屏幕更注重转移精度,大尺寸屏幕更注重转移速度。以下对几种路线的优劣进行对比和分析:

激光转移:适用于小尺寸的屏幕,它和检测修复连接的更加紧密,因此更容易修复坏点。

stamp (范德华力): 在组装速度和选择性转移方面更占优势,但是也存在芯片必须使用弱化结构的问题,弱化结构意味着芯片的阵列密度和结构需要做一定程度上的牺牲。并且,如果控制不好,组装的面板可能会产生整体偏移,这将是致命性的错误。而且,如果出现坏点,相比于激光转移,范德华力路线的修复坏点过程更为棘手和复杂。

流体组装:可用于制造大尺寸的屏幕,良率也稳步提升,比如首尔大学与LG合作开发的流体自组装技术,实现了高达99.88%的组装良率。但是,需要保护晶圆不受损害,所以流体控制和工艺参数需要进行精准调控,并且对于小尺寸的屏幕,可能不如其它转移技术有效。

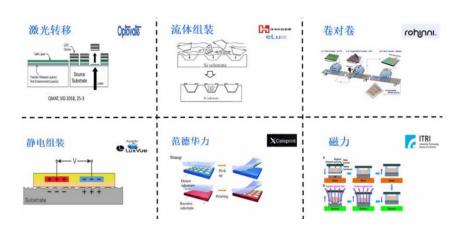


图 14 几种主要的巨量转移技术路线

第四章 Micro LED 面临的挑战

目前,在走向应用化和商业化的进程中,Micro-LED 遇到的挑战困难重重,主要包括经济方面的挑战、技术等方面的挑战。

4.1 技术方面的挑战

4.1.1 巨量转移技术

相比于已经在市面上大规模问世的 OLED, Micro-LED 与 OLED 的其中的最大工艺区别之一就是巨量转移技术。Micro-LED 的生产过程中,需要将大量微小的 LED 芯片精确地转移到目标基底上,这个过程称为巨量转移(Mass Transfer)。目前,这项技术还不够成熟,存在转移精度和均匀性问题、转移精度和均匀性问题和材料兼容性问题。

4.1.2 全彩技术

目前,相比于蓝色和绿色 LED, Micro-LED 中, 红色 LED 的效率相对较低。主要因为:

- 1. 从量子阱结构来说,红光的波长最长,所以量子阱的宽度最长,这就导致了电子和空穴 在量子阱中复合的概率降低,发光效率也相应降低。[17]
- 2. 目前制造红光 Micro-LED 的材料相比于蓝光和绿光的半导体材料,晶体结构更加复杂, 从而导致电子能级更加复杂,这也影响了红光的发光效率

4.1.3 驱动技术

Micro-LED 的驱动技术升级也面临着诸多困境。尤其是在保持高效率和低功耗的同时,还要确保快速响应和稳定性。目前,研究和开发的驱动技术主要分为被动驱动和主动驱动两种技术,但都面临成本和复杂性的挑战。

4.1.4 修复技术

修复技术与巨量转移技术息息相关,甚至就是巨量转移技术的一部分。修复技术是用于提高良率的一种方法。随着尺寸变小,用于实现修复操作的 MEMS 系统也要同步缩小,而这是一个巨大的挑战。如果想要通过冗余设计来提高良率,又会面临成本的上升和额外的电路和空间占用。

4.2 市场方面的挑战

4.2.1 成本

Micro-LED 需要使用微纳级别的工艺,这就对洁净间等配套设施提出更高的要求。同时,更小的发光单元、更密集的控制模块也会抬高成本。并且,目前 Micro-LED 的制造良率偏低,这会造成极大的损耗,进一步推高成本。

4.2.2 竞品

目前与 Micro-LED 对标的竞品主要为 OLED。OLED 和 Micro-LED 都是自发光器件,但是相比于 Micro-LED,OLED 不仅拥有更低的制造成本、更成熟的生产技术,并且 OLED 天生更支持例如曲面屏、折叠屏等的柔性显示场景。作为发展尚未过时的 OLED,想要将市场从 OLED 中替换到 Micro-LED 存在很大阻力

4.2.3 使用场景

Micro-LED 具有的高分辨率、高亮度、低功耗和快的响应速度的优点。但是缺少契合这些优点的使用场景。目前仅有 AR/VR 产业相关是 Micro-LED 的优势场景。

第五章 总结

Micro-LED 作为一种新兴的显示技术,具有高亮度、低功耗、快速响应、高分辨率等优势,在微型显示、可见光通信、生物医学等领域展现出巨大的应用潜力。本文对 Micro-LED 的相关制造工艺和器件结构做了简要讨论。然而,Micro-LED 目前仍面临巨量转移技术、全彩技术、驱动技术和修复技术等挑战,需要进一步研究和突破。同时,Micro-LED 也需要应对来自 OLED 等竞品的竞争以及高昂的成本问题。未来,随着技术的不断进步和成本的降低,Micro-LED 有望成为下一代主流显示技术之一,为人们带来更加优质的视觉体验。

Micro-LED 的蓬勃发展,犹如一块待开发的宝地,机遇与挑战并存。对于科研人员而言,这正是展现才华、攻坚克难的时刻。我们有信心也有能力,在不久的将来,攻克这些技术难题,推动 Micro-LED 朝着产业化的方向迈进。随着大屏幕和小型化设备的广泛应用,Micro-LED 将成为显示技术的新宠,引领未来显示技术的发展潮流。科研工作者们正一步步突破技术壁垒,相信 Micro-LED 必将在显示技术领域绽放光彩。

参考文献

- [1]S. X. Jin, J. Li, J. Z. Li, J. Y. Lin, H. X. Jiang; GaN microdisk light emitting diodes. Appl. Phys. Lett. 31 January 2000; 76 (5): 631–633.
- [2]Xu Y, Cui J, Hu Z, et al. Pixel crosstalk in naked-eye micro-LED 3D display[J]. Applied Optics, 2021, 60(20): 5977-5983.
- [3] Wang Z, Zhu S, Shan X, et al. Full-color micro-LED display based on a single chip with two types of InGaN/GaN MQWs[J]. Optics Letters, 2021, 46(17): 4358-4361.
- [4] Huang Y, Hsiang E-L, Deng M-Y, et al. Mini-LED, Micro-LED and OLED displays: present status and future perspectives[J]. Light: Science & Applications, 2020, 9(1): 1-16.
- [5] Ji B, Guo Z, Wang M, et al. Flexible polyimide-based hybrid opto-electric neural interface with 16 channels of micro-LEDs and electrodes[J]. Microsystems & Nanoengineering, 2018, 4(1): 27
- [6]Xiong J, Hsiang E-L, He Z, et al. Augmented reality and virtual reality displays: emerging technologies and future perspectives[J]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 216.
- [7] Li L, Lu L, Ren Y, et al. Colocalized, bidirectional optogenetic modulations in freely behaving mice with a wireless dual-color optoelectronic probe[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 839.
- [8] Carreira J F C, Xie E, Bian R, et al. On-chip GaN-based dual-color micro-LED arrays and their application in visible light communication[J]. Optics Express, 2019, 27(20): A1517-A1528.
- [9] R. X. G. Ferreira et al., "High Bandwidth GaN-Based Micro-LEDs for Multi-Gb/s Visible Light Communications," in IEEE Photonics Technology Letters, vol. 28, no. 19, pp. 2023-2026, 1 Oct.1, 2016, doi: 10.1109/LPT.2016.2581318.
- [10]郭浩中, 赖芳仪, 郭守义. LED 原理与应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2013.
- [11]Z. Li et al., "Bandwidth Analysis of High-Speed InGaN Micro-LEDs by an Equivalent Circuit Model," in IEEE Electron Device Letters, vol. 44, no. 5, pp. 785-788, May 2023, doi: 10.1109/LED.2023.3256422.
- [12]C. -L. Lin et al., "Compensation Pixel Circuit to Improve Image Quality for Mobile AMOLED Displays," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 54, no. 2, pp. 489-500, Feb. 2019, doi: 10.1109/JSSC.2018.2881922.
- [13]Z. J. Liu, K. M. Wong, C. W. Keung, C. W. Tang and K. M. Lau, "Monolithic LED Microdisplay on Active Matrix Substrate Using Flip-Chip Technology," in IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 15, no. 4, pp. 1298-1302, July-aug. 2009, doi: 10.1109/JSTQE.2009.2015675.
- [14] HERBERT S. Wire bonding process control [J]. Ad-vanced Packaging, 2008, 17(1): 32-34.
- [15]SAIKI H, MARUMO Y, NISHITAKE H, et al. De-formation analysis of Au wire bonding [J] . Journal of Materials Processing Technology, 2006, 177(1–3):709–712.
- [16]T. Shiraishi, K. Amami, S. Yuhaku, Y. Bessho, K. Eda and T. Ishida, "Stud-bump bonding technique onto an advanced organic substrate for MCM-Ls," Proceedings 1997 International Conference on Multichip Modules, Denver, CO, USA, 1997, pp. 109-114, doi: 10.1109/ICMCM.1997.581157.
- [17]Waqar AZEEM, 刘召军, 伏桂月. 基于III族氮化物的 Micro-LED 挑战及潜在解决方案[J]. 液晶与显示, 2023, 38(7): 892. Waqar AZEEM, Zhao-jun LIU, Gui-yue FU. Challenges and potential solutions of III-nitride based Micro-LEDs[J]. Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, 2023, 38(7): 892.